SCANFLEX® II BLADE 4 RMx1/2/3

Multifunktionaler JTAG/Boundary Scan Controller

- 1, 2 oder 3 SFX II BLADE 4 in einem 19″ 1HE Gehäuse
- jeder einzelne Controller ist unabhängig, mit separaten USB/LAN und Power-Anschluss
- Hochleistungscontroller für Embedded Test und Programmierung
- hervorragende Flexibilität durch multifunktionale I/O-Kanäle und FPGA-Instrumentierung für Mixed-Signal-Tests und Highspeed-Tests
- unerreichte Modularität und Skalierbarkeit durch konfigurierbare TAP Interface Cards und zusätzliche I/O-Module
- integrierte Kompakteinheit steuerbar über USB 3.0 und GBit-LAN

GOPEL electronic
Enjoy Testing

Technische Daten

SCANFLEX® II BLADE 4 RMx1/2/3 - Boundary Scan Controller

Parameter (für einen Slot)	
Anzahl der TAP-Slots	4 (unabhängig und individuell konfigurierbar mit TAP-Einsteckkarten)
maximale TCK-Frequenz	20/50/100 MHz (per Software einstellbar)
parallele I/O-Kanäle	64 Mixed-Signal-Kanäle kombiniert mit FPGA, individuell konfigurierbar als Input, Output, Tri-State, per Software programmierbare V_{IO} 0,9-3,6 V (8 Gruppen mit 8 I/O)
maximale Anzahl von I/O-Modulen	30 Module via externen SFX-Carriern
integrierte Technologien	SPACE™, HYSCAN™, ADYCS™, ChipVORX®, FastScale™

BLADE 4 RMx1

BLADE 4 RMx2

BLADE 4 RMx3

Embedded Test

- Support neuester Technologien wie Processor Emulation Test, FPGA Assisted Test und Embedded Diagnostics Test
- Synchronisation mit den multi-funktionalen I/O-Kanälen und ChipVORX-FPGA-Instrumenten

Leistungsstärke

- Einsatz modernster Multi-Core-Prozessoren und FPGAs
- gleichzeitiger Betrieb mit bis zu 100 MHz an allen TAPs
- Betrieb mit bis zu 100 MHz an I/O-Kanälen
- Support für Parallelbetrieb

Software

- Integration in Embedded JTAG Solutions Plattform SYSTEM CASCON™
- Plug-and-Play Integration in 3rd Party Systeme
- offener Mix von Test- und Programmierprozeduren in einer Umgebung

Embedded Programmierung

- Highspeed-Programmierung von Flash-Komponenten wie NAND, NOR, SPI, I²C, eMMC, usw. (auch über I/O)
- universelle Programmierung von µControllern
- Programmierung von FPGA/PLD

SCANFLEX® II BLADE 4 RMx1/2/3

Flexibler Controller für Embedded Test und Programmierung

Erweiterbarkeit pro Slot

- Unterstützung von bis zu 30 parallel angesteuerten SCANFLEX® I/O-Modulen
- skalierbare Anzahl von einem bis vier TAPs
- Schnittstellen für zusätzliche Debug- und Steuerkomponenten

Adaptierbarkeit

- problemlose Überbrückung von bis zu vier Meter großen Distanzen zum Target ohne TCK-Reduktion
- Software-parametrisierbare I/Os (Slew rate, Impedanz, Terminierung)
- Software-selektierbare Protokolle (JTAG, DAP, COP, SWD, BDM, SBW, UART etc.)

Made in Germany

GOPEL electronic
Enjoy Testing

GÖPEL electronic GmbH
Göschwitzer Str. 58/60
07745 Jena · Deutschland
03641 · 6896 0 Fon
03641 · 6896 944 Fax
sales@goepel.com
www.goepel.com

ISO 9001 zertifiziert
sales@goepel.co.uk
sales@goepelusa.com
sales@goepel.asia
sales@goepel.in

SCANFELX II BLADE 4 RMx1/2/3/D/10-2018